チップ外観検査装置

Vi-4000 シリーズ
Vi-3000/2000/1000 シリーズ

Vi-4000 SERIES

Vi-3000 SERIES

Vi-2000 SERIES

Vi-1000 SERIES

目視外観検査の全工程を自動化

□ 前工程からイントレイ検査まで充実のラインアップ □

Vi-4300 NEW

フルオート機

パターン付ウェーハを高速スキャンニングと高速画像処理で全自動検査します。高い検出再現性と疑似欠陥を抑える検出パラメータによりレビューレスでの運用が可能となります。従来機より高画素のカメラを採用し、より高速な検査ができます。300mmFOUP、オープンカセット・ダイシングフレーム付ウェーハに対応。

Vi-4000 シリーズ

フルオート機

高速検査に対応した高性能モデルです。

Vi-2000 シリーズ

フルオート機

ウェーハはもちろんダイシングフレーム付ウェーハに対応します。

Vi-3000 シリーズ

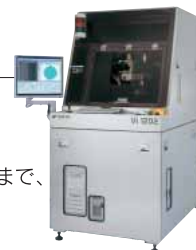
イントレイ機

トレイ内のチップを非接触で自動検査し、不良チップの抜き取りを行います。ウェーハ対応機の検査アルゴリズムを搭載し、業界最高のスループットを実現しました*。

＊2005年7月 日刊工業新聞発表時

Vi-1000 シリーズ

セミオート機

自動搬送機構を省いたセミオートモデルです。MEMS、化合物半導体などでの試作から量産まで、幅広く対応します。

□ Merit

1	**生産性のアップ** 高速検査により生産性を大幅にアップすることが可能となります。
2	**検査コストの削減** 検査員の省人化、省力化に効果を発揮し検査コストを大幅に削減できます。
3	**個人誤差の解消** 検査員の個人誤差を解消し検査を標準化できます。
4	**品質安定** 高い判定一致率により安定した品質を確保できます。
5	**歩留まり向上** チップ内のエリア毎に、判定する欠陥サイズを指定できますので過剰な検査を防止し、良品率を向上できます。

□ Feature

■ 目視外観検査全工程に対応

50mm～300mmウェーハ、ダイシングフレーム付ウエーハ、イントレイチップに対応します。

■ 高精度検査

部位分類機能、回転補正機能、保護膜エッジ過検出防止機能などの他、多数の画像処理機能により高精度に検査することが可能です。目視検査との一致率も非常に高くなっています。(オプション含む)

■ 簡単レシピ作成

統計誤差画像処理による自動学習方式の為簡単に、短時間に検査プログラムの作成が可能です。又、ほとんどの検査パラメータが変更できますので、再学習することなくプログラム変更が可能です。

■ マルチチップ検査

視野内の複数チップを一括検査でき、高速検査が可能となります。

■ エリア分割検査

大型チップは検査エリアを分割して検査できます。あらゆるチップサイズが検査可能です。

■ 豊富なオプション

インカー、上流・下流装置とのデータ通信、欠陥分類、オフラインレシピレビューシステム、リング照明、エアブロー、イオナイザ、HEPAフィルタ、ウェーハID対応、他

ご用命は

※画面は一部はめ込み合成です。
※カタログの掲載商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。
※カタログ掲載商品には別売品が含まれている場合があります。
※カタログと実際の商品の色とは、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読み下さい。

(株)トプコン本社・工場・営業所

(株)トプコン本社

株式会社トプコン

本　社　〒174-8580　東京都板橋区蓮沼町75-1　ホームページ　http://www.topcon.co.jp
産業機器営業部 Vi販売グループ　TEL 03(3558)2504　FAX 03(3965)6821
大　阪　〒577-0012　東大阪市長田東1-3-12　TEL 06(6788)6003　FAX 06(6788)6004

Printed in Japan 2005 12CMI 1083-1